



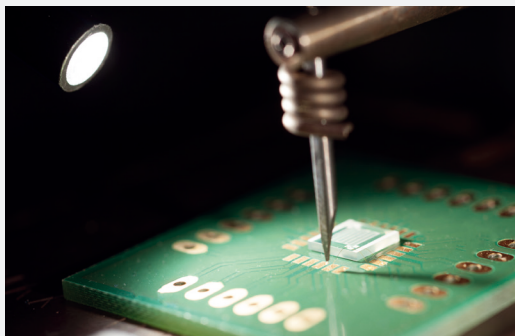
Ausstattung am Standort Zweibrücken Analytik

Neue Technologien

- Klimaschrank (Binder, KBF 240)
- Mobile Reinraumzelle
- Heißpräganlage (Jenoptik, HEX 01)
- Keramik-Brennofen (Nabertherm, B150)

Aufbau- und Verbindungstechnik

- Wedge-Wedge-Bonder (Westbond, 7602C-79C)
- Pick and Place-System (Dr. Tresky, 3002)
- Bond-Tester (XYZTec, Sigma)
- Microplacer (Essemtec, MPL3100)
- SMD-Arbeitsplatz (ERSA IR 500A)
- Heißluftstation (Weller, WTHA 1)
- Reflow-Ofen (LPKF ProtoFlow S)



Chemische Analytik

- HPLC mit RID und DAD (Agilent, 1100 Series)
- AAS (Perkin-Elmer, 1100B)
- UV-VIS-Spektrometer (Perkin-Elmer, Lambda 40)
- Potentiostat (Metrohm, Autolab PGSTAT 302N)
- Potentiostat (Metrohm, Autolab PGSTAT204/ FRA32M)
- Potentiostat (Biologic-Gamec, SP-200)



Zelluläre Elektrophysiologie

- Patch-Clamp-Messplatz mit Fluoreszenzmikroskop und Substanz-Applikation
- MEA-System mit Heizung und Stimulation für Standard- und perforierte Chips
- Zell-Injektionssystem (Eppendorf, FemtoJet)

REM-Labor

- Rasterelektronenmikroskop (Zeiss, Supra 40) mit EDX (BrukerAXS, Quantax)
- Rasterelektronenmikroskop (Leo, 435vp) mit EDX (Röntec, SiLi)
- Schleif-/Poliermaschine (Struers, Rotopol 21, Rotoforce 4)
- Ionenätzanlage (Leica, TIC3X)
- Proben-Coater für Rasterelektronenmikroskop (Cressington, 108auto (Au); Leica ACE 600 (Cr/C))

Kontakt:

Hochschule Kaiserslautern
Amerikastraße 1
66482 Zweibrücken

Prof. Dr. Monika Saumer
monika.saumer@hs-kl.de
T +49 631 3724-5420

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Lilischkis
rainer.lilischkis@hs-kl.de
T +49 631 3724-5456

Metrologie

- Mechanisches Profilometer (Bruker, DektakXT)
- Optisches Profilometer (UBM)
- AFM (Bruker, Dimension Icon)
- AFM (Digital Instruments, Dimension 3100)
- Raman Workstation (Horiba Scientific, LabRAM HR Evolution mit AIST/AFM Combiscope)
- Röntgenreflektometer XRR (Bruker AXS, D8 Advance)
- Spektroskopisches Ellipsometer (Sentech, SE850)
- Kontaktwinkelmessgerät (DataPhysics Instruments, OCA 15)
- Weißlichtinterferometer (Bruker, ContourGT)
- SPR (BioNavis Ltd, MP-SPR Navi 210A Vasa)
- Mikroskope (z. B. Olympus, BX51)

Elektrische und magnetische Charakterisierung

- LCR Meter (Agilent, 4284A)
- Multimeter DMM (HP, 34401A)
- Parameteranalyzer (Agilent, 4156C; Keithley, 4200)
- Vibrationsmagnetometer (Eigenbau)

Impedanz-Messplatz

- FET-Mini-Verstärker (Eigenbau, 16-Kanal)
- FET-Verstärker (Eigenbau, 16-Kanal)
- MEA-Verstärker (Eigenbau, 64-Kanal)
- Impedanzmessplätze (Zahner Zennium E, Ivium Compactstat)
- Lock-In-Verstärker (Stanford Research, SR 830; Zürich Instruments, HF2LI)

<https://www.hs-kl.de/ims>